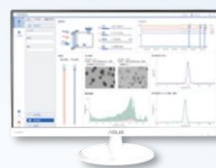


partica

パーティカ

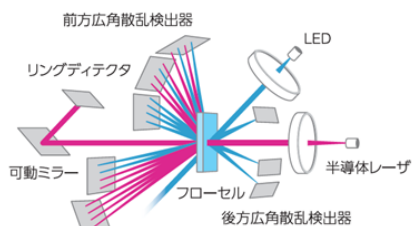
レーザー回折式と動的画像解析装置の2原理を用いた
今までにない高性能 粒子径・形状評価装置



開催日時：2026年7月2日（木）10時～16時30分
開催場所：福井大学 文京キャンパス 産学官連携本部

レーザー回折/散乱式

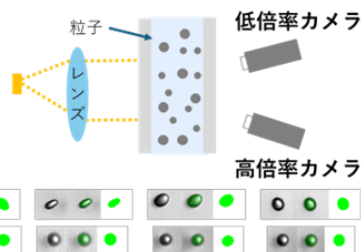
- ワイドレンジを高精度に測定
0.01 μm - 5000 μm
- 業界トップクラス※1の高精度測定
標準粒子の規格から $\pm 0.6\%$ 以内



※1 当社調べ

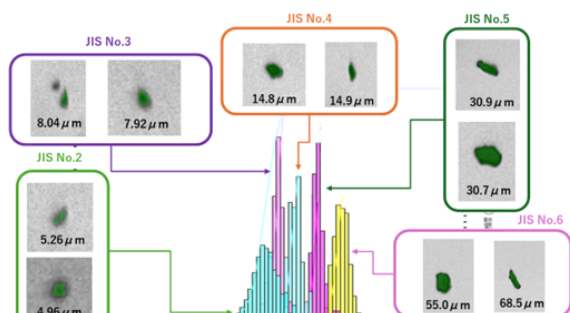
動的画像解析

- 粒子画像を高速で大量に取得
毎秒120枚の画像取得、約10,000粒子
- 豊富な画像解析機能
形状パラメータ 30種類以上

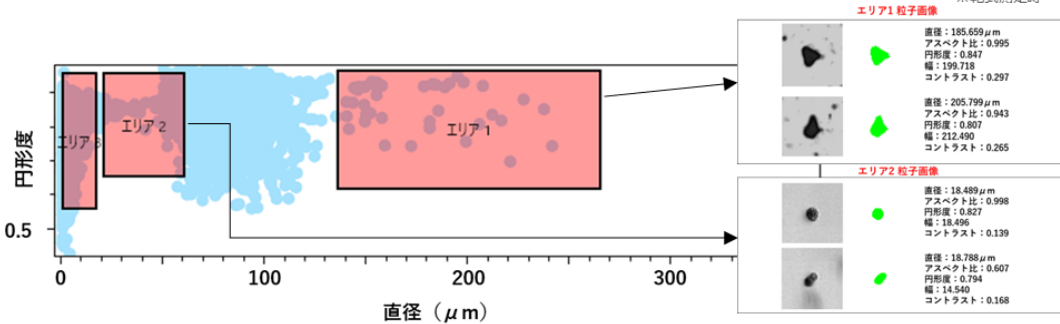


画像解析機能でできること

- 取得した粒子画像から分布図を作成
パラメータを選択し、用途に応じた
分布図を作成可能
エリアを選択し、画像の表示が可能
- 低頻度の粒子、異物の認識が可能
大量に高解像度画像を取得することにより、
低頻度の粒子の認識が可能
さらに取得した光学画像から原因特定も可能



※JISアルミナ標準試料
※乾式測定時



轟産業株式会社

福井支社 TEL (0776) 36-5522

ぜひ、実機を見に来てください！

デモ測定・ご相談も承ります。

粒子の見える化で、粒子計測をより多角的に。
Particaが新たな価値を提供します。

HORIBA